**Гудкова, Ольга Николаевна. Методы логико-временного анализа цифровых СБИС с учетом деградации порогового напряжения транзисторов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.12 / Гудкова Ольга Николаевна; [Место защиты: Ин-т проблем проектирования в микроэлектронике РАН].- Москва, 2011.- 151 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/3053**